

8H30 — 9H00: Accueil des Visiteurs

9H00 : Introduction et présentation de la journée

9H15 : Marvin Test solutions

Titre : La Simulation matériel et logiciel dans un système de test automatique

Conférencier : Victor Fernandes, European Manager

Résumé : Cette présentation examine les exigences et les méthodes associés à l'exécution d'un programme de test en mode simulation. La simulation nécessite l'exécution de l'application avec un sous-ensemble de l'instrumentation ou sans instrumentation et avec ou sans l'unité sous test (UUT). La solution présentée expose en détail la mise en œuvre d'un système de simulation qui est créé par l'amélioration du moteur d'exécution de l'application qui fait partie d'un environnement logiciel de développement d'applications commerciales (ATEasy).

9H45 : ADLINK

Titre : Avantages du PXI Express pour les applications nécessitant une grande bande passante

Conférencier : Christian Ropars, Président Acquisys

Résumé : Le PXI Express permet aujourd'hui de réaliser des applications nécessitant des bandes passantes de plus en plus élevées. Cependant dans ces applications tous les éléments, incluant la ressource d'acquisition, le contrôleur PXI Express, l'unité de stockage mais également le châssis, ont une grande importance. Le routage du bus PCIe sur le fond de panier peut s'avérer complexe. ADLINK propose aujourd'hui des solutions parmi les plus performantes permettant de réaliser ces applications avec une bande passante élevée.

10H30 : Pause et visite expo

11H00 : Signadyne

Titre : Bringing PXIe and FPGA Technologies Together to Boost Test and Measurement Equipment.

Conférencier : Marc Almendros, CEO—Chief Executive Officer

Résumé : One of the key advantages of the PXI standard is the capability to create test equipment which is built with standard hardware but with custom software. This customization allows the user to perform more efficient test operations with a cost-effective solution. However, the rising complexity of current test applications demands faster test equipment, and this is where FPGA technology comes in. Signadyne's FPGA technology provides easy-to-use hardware customization, giving as a result hardware-accelerated test and measurement equipment.

11H30 : Keysight Technologies

Titre : Speed up test, optimization and validation of next generation power amplifier front end module

Conférencier : Rob HOOD ou Jonathan COSSARD

Résumé : The presentation will detail a modular solution that addresses two key test challenges facing power amplifier (PA) front end module (FEM) manufacturers: reducing cost and increasing data throughput. Both must be done despite the addition of more complex test techniques such as envelope tracking (ET) and digital pre-distortion (DPD) being employed to overcome efficiency issues caused by high peak to average ratio modulation formats.

The RF PA/FEM characterization & test Reference Solution enables rapid, full characterization of next-generation power amplifier modules such as PAD devices, including measurements for S-parameter, demodulation, power, adjacent channel power, and harmonic distortion. With the M9451A PXIe FPGA Measurement Accelerator, closed/open loop digital pre-distortion and envelope tracking measurements can be made in tens of milliseconds.

12H00 : Pause et visite expo

12H30 : Buffet et visite expo

14H00 : VTI Instruments

Titre : Synchroniser plusieurs châssis PXI Express par Ethernet

Conférencier : Frédéric Martial, Responsable VTI Instruments Europe

Résumé : Traditionnellement, les systèmes de test destinés à l'acquisition de données de capteurs sont installés dans une salle de contrôle centralisée. Ceci est fait dans le but de pouvoir synchroniser précisément les instruments et les données issues des acquisitions des capteurs. A une petite échelle, sur un oscilloscope multivoies par exemple, nous considérons comme acquise la synchronisation des données, et l'affichage de celles-ci à l'écran est étroitement lié au temps. On peut considérer ces données sur l'oscillo comme déterministes dans la mesure où nous voyons et enregistrons l'ordre des événements selon une séquence cadencée. Cependant les oscilloscopes n'offrent qu'un nombre de voies limité. La clé est de pouvoir étendre ce principe aux systèmes d'acquisition modulaires.

Dans le sport automobile, il est important de savoir qui passe la ligne d'arrivée le premier et l'ordre d'arrivée des compétiteurs. Cette exigence est exactement la même pour la plupart des systèmes d'acquisition multi voies. Connaître l'ordre des événements et leur assigner une date à chacun est crucial pour le traitement des données après les tests.

Dans cette présentation, nous allons vous parler de plateformes modulaire PXI Express et des méthodes pour synchroniser plusieurs châssis PXIe dans un système distribué.

14H30 : CHROMA ATE

Titre : How to achieve high speed / high accuracy sourcing and measurement by using PXI based SMU

Conférencier : Jeff Lee, Product Marketing Director

Résumé : Many modern electronic devices require high precision voltage/current sourcing and measurement. Despite obvious motivation - increase test throughput, for high speed sourcing and measurement, many don't realize the source and measurement speed and the control timing accuracy can also be important factor to the accuracy of the measurements.

In this talk, we'll start from the benefits of higher source & measurement speed and how that may affect measurement accuracy. Then few application examples will be discussed. And finally, we'll end up at the features provided in Chroma PXI based SMU to achieve high speed yet accurate voltage/current sourcing/measurement."

15H00 : Pause et visite expo

15H30 : Mac Panel

Titre : Choisir la bonne solution de connexion pour les systèmes de test PXI

Conférencier : Christian Ropars, Président Acquisys

Résumé : Dans un système de test, l'interconnexion des équipements de test avec l'unité à tester est un élément important. En effet, les performances globales du système et son évolution peuvent être limitées par le câblage. Cette présentation examine les différentes solutions de connexion pouvant être utilisées pour la réalisation de systèmes de test basés sur l'instrumentation modulaire PXI, avec leurs avantages et inconvénients. Trois solutions sont envisagées, câbles individuels, solution d'interconnexion traditionnelle et solution interconnexion avancée.

16H00 : SPHEREA Test & Services

Titre : ATEC DynaSeries : L'entrée du PXI dans les bancs de test de SPHEREA

Conférencier : Nicolas FAVARQ

Résumé : La nouvelle génération de bancs de test de SPHEREA fait appel aux ressources PXI. C'est une nouvelle orientation, comment SPHEREA a abordé l'intégration du PXI dans ses nouveaux bancs

16H30 : Conclusions et fin des conférences

